

УДК 621.315.592

## ДИНАМИКА ФОТОИНДУЦИРОВАННОГО ПРОСТРАНСТВЕННОГО ЗАРЯДА В ПОЛУПРОВОДНИКАХ

*Н. А. Кудряшов, С. С. Кучеренко, Е. А. Мазур*

Исследована динамика фотоиндуцированного заряда во внешних электрических полях в полупроводниках с собственной проводимостью. Рассмотрены случаи металлических и диэлектрических контактов. Получено численное решение задач, описываемых системой нелинейных уравнений непрерывности и уравнением Пуассона. Установлено существование максимумов в распределениях электронов и дырок, величина и положение которых определяются параметрами полупроводника, приложенным напряжением и интенсивностью фотогенерации. Для стационарного режима процесса получено аналитическое решение. Определены условия, при которых распределения концентраций электронов и дырок имеют максимумы, найдены значения их координат. Проведено сравнение аналитического и численного решений.

В связи с развитием оптических методов обработки информации представляет большой практический и теоретический интерес исследование нелинейных процессов перераспределения фотоиндуцированных зарядов в полупроводниковых средах. В [1-3] проведено изучение динамики фотоиндуцированных зарядов в фоторефрактивных кристаллах, используемых в качестве активных элементов пространственно-временных модуляторов света. В [1] показана возможность стратификации объемного заряда (СОЗ) при наложении электрического поля на полупроводник (п/п) с глубокими центрами захвата и при наличии в нем первоначально однородной неравновесной плазмы. Явление заключается в образовании многослойной знакопеременной структуры объемного заряда.

Как отмечается в [1], СОЗ — устойчивый детерминированный процесс и принципиально отличается от явлений типа возникновения волн пространственной перезарядки ловушек [4] и рекомбинационных волн [5], проявляющихся вследствие различных типов неустойчивости в плазме п/п.

В [2, 3] обнаружено своеобразное поведение распределения электрического поля и плотности зарядов, возникающее под действием освещения со стороны катода и приложенного внешнего напряжения. Эффект заключается в образовании «узкого горла» в распределении электрического поля по координате. Динамика объемного заряда представляет собой процесс возникновения ступенчатого распределения положительного заряда и движение пакета отрицательного заряда к аноду.

В данной работе исследована динамика фотоиндуцированного заряда и электрического поля в п/п с собственной проводимостью. Рассмотрение таких процессов важно при анализе работы фотодетекторов, при создании методик диагностики неравновесных состояний в п/п, а также при разработке оптоэлектронных модуляторов миллиметровых волн. Как показано в [6], взаимодействие миллиметровых волн с оптически индуцированной п/п плазмой дает возможность осуществлять контроль за фазой и амплитудой волны, распространяющейся через п/п волновод.

Рассмотрим п/п пластину длиной  $L$ , находящуюся в поле оптического излучения интенсивности  $G$ , к которой приложено постоянное напряжение  $U_0$ . В такой системе на фоне роста концентрации фотогенерированных электронно-дырочных пар происходит дрейф свободных носителей под дейст-

вием электрического поля. Процесс перераспределения неравновесных носителей в одномерном случае описывается следующей системой уравнений

$$\left. \begin{aligned} \frac{\partial n}{\partial t} &= -\frac{\partial}{\partial x} j_n + G - R, \\ \frac{\partial p}{\partial t} &= -\frac{\partial}{\partial x} j_p + G - R, \\ \frac{\partial E}{\partial x} &= e/\epsilon\epsilon_0 (p - n), \\ j_n &= -\mu_n n E - D_n \frac{\partial n}{\partial x}, \\ j_p &= \mu_p p E - D_p \frac{\partial p}{\partial x}. \end{aligned} \right\} \quad (1)$$

Здесь  $j_n$  и  $j_p$  — плотность потоков концентраций электронов и дырок,  $E$  — напряженность электрического поля,  $\mu_n$  и  $\mu_p$  — подвижности,  $D_n$  и  $D_p$  — коэффициенты диффузии электронов и дырок соответственно,  $\epsilon$  и  $\epsilon_0$  — относительная и абсолютная диэлектрические проницаемости,  $R$  — скорость рекомбинации по Шокли—Риду со временем жизни неравновесных носителей, равным  $\tau$ .

Начальные условия имеют вид

$$p(x, 0) = p_0, \quad n(x, 0) = n_0, \quad E(x, 0) = E_0. \quad (2)$$

Здесь  $n_0$  и  $p_0$  — равновесные значения концентраций электронов и дырок,  $E_0 = V_0/L$ .

Рассматриваются два типа контактов: контакты металл—п/п

$$\left. \begin{aligned} n(0, t) &= n(L, t) = n_0, \\ p(0, t) &= p(L, t) = p_0 \end{aligned} \right\} \quad (3)$$

и контакты диэлектрик—п/п

$$\left. \begin{aligned} j_n(0, t) &= j_n(L, t) = 0, \\ j_p(0, t) &= j_p(L, t) = 0. \end{aligned} \right\} \quad (4)$$

Условия (3) получены в предположении справедливости на контакте условий термодинамического равновесия ( $np = n_i^2$ ,  $n_i$  — собственная концентрация п/п) и нейтральности ( $p - n = 0$ ). Диэлектрические контакты (4) образуются при помещении между поверхностью п/п и электродами тонкой диэлектрической прослойки, что приводит к отсутствию потока носителей через контакт. Далее граничные условия (3), (4) будем называть соответственно условиями металлических и диэлектрических контактов. Граничные условия (3), (4) дополняются условием на электрическое поле

$$\int_0^L E(x, t) dx = V_0. \quad (5)$$

Аналитическое решение нелинейной задачи (1)—(5) в общем случае найти не удастся. В случае сильного электрического поля  $E_0$ , когда дрейфовый механизм играет определяющую роль в динамике неравновесных носителей заряда, можно получить аналитические соотношения, отражающие основные свойства рассматриваемого процесса. Заметим, что в [2] получено аналитическое решение исследуемой проблемы в случае монополярной проводимости ( $\mu_p \Rightarrow 0$ ).

Будем полагать, что поле  $E(x, t)$  направлено в сторону отрицательных  $x$  ( $U_0 < 0$ ). При рассмотрении случая достаточно сильного поля  $E(x, t)$  диффузионной частью потока дрейфующих к правому контакту электронов можно пренебречь во всей области течения за исключением области правого контакта. В этой приконтактной области накопление отрицательных зарядов может привести к образованию больших градиентов концентрации электронов, а следовательно, и к значительной величине диффузионной составляющей потока. Аналогичная ситуация имеет место для дырок (с точностью до направления движения).

Рассмотрим случай металлических контактов (3). При достаточно больших  $t$  ( $t \gg \max(t_n^c, t_p^c)$ ,  $t_n^c = L/\mu_n |E_0|$ ,  $t_p^c = L/\mu_p |E_0|$  — пролетные времена соответственно электронов и дырок) процесс выходит на стационарный режим, описываемый системой

$$\left. \begin{aligned} d \cdot dx (\mu_n n E) + G &= 0, \\ d \cdot dx (\mu_p p E) - G &= 0, \\ d \cdot dx E = e \varepsilon_0 (p - n). \end{aligned} \right\} \quad (6)$$

При записи системы (6) было сделано предположение о несущественном влиянии рекомбинации на ход процесса. Данное предположение, как будет показано ниже, в рассматриваемом случае выполняется. Система уравнений первого порядка (6) дополняется граничными условиями

$$\left. \begin{aligned} n(0) = n_0, \quad p(L) = p_0, \\ \int_0^L E(x) dx = U_0. \end{aligned} \right\} \quad (7)$$

Далее предполагается  $n_0 = p_0$  (беспримесный п/п). Решение системы обыкновенных дифференциальных уравнений (6), (7) имеет вид

$$\left. \begin{aligned} n(x) &= -(Gx + a)/\mu_n E, \\ p(x) &= (Gx + b)/\mu_p E, \\ E(x) &= -(Gax^2 + cx + d)^{1/2}, \end{aligned} \right\} \quad (8)$$

где  $\alpha = e/\varepsilon_0 \mu_p (1 + \kappa)$ ,  $\kappa = \mu_p/\mu_n$ ,  $c = 2e/\varepsilon_0 \mu_p (b + \alpha x)$ . Постоянные интегрирования  $a$  и  $b$  находятся из граничных условий на концентрации носителей

$$\left. \begin{aligned} a &= -\mu_n n d^{1/2}, \\ b &= -(d/L^2 + 2d^{1/2} \alpha n_0 \mu_p / (1 + \kappa) L + G\alpha (\kappa - 1)/(\kappa + 1) + \\ &+ \alpha^2 p_0^2 \mu_p^2 / (1 + \kappa)^2)^{1/2} L \mu_p p_0 - GL + L \alpha \mu_p^2 p_0^2 / (1 + \kappa). \end{aligned} \right\} \quad (9)$$

Константа  $d$  определяется из условия постоянства потенциала (7)

$$\left| v_0 \right| = -(2G\alpha L + c) E(L)/4G\alpha + cE(0)/4G\alpha + (4G\alpha d - c^2)/8(G\alpha)^{3/2} \times \\ \times \ln \left| (-2E(L)(G\alpha)^{1/2} + 2G\alpha L + c)/(-2E(0)(G\alpha)^{1/2} + c) \right|. \quad (10)$$

Из (8)—(10) следует, что плотности потоков концентрации описываются линейными зависимостями

$$\left. \begin{aligned} j_n &= Gx + a, \\ j_p &= Gx + b, \end{aligned} \right\} \quad (11)$$

полный ток  $j$  равен

$$j = j_p - j_n = -GL + n_0 \mu_n (E(0) + \kappa E(L)). \quad (12)$$

Распределения  $n(x)$ ,  $p(x)$  имеют максимумы в точках  $x_{0n}$ ,  $x_{0p}$ , выражения для которых не приводятся из-за их громоздкости. При условии

$$0 < x_{0n} < L, \quad 0 < x_{0p} < L \quad (13)$$

координаты максимумов находятся в пределах полупроводникового образца. Неравенства (13), рассматриваемые как условия на параметр  $d$  ( $x_{0n}$ ,  $x_{0p}$  — функции  $d$ ), задают через (10) условия на  $U_0$ . При нарушении этих условий точки максимумов расположены вне образца. Фактически это означает, что гребни волн фотоиндуцированных зарядов доходят до границ области образца и исчезают, однако при рассмотрении такой ситуации необходимо учитывать диффузионные процессы в приконтактной области.

Перераспределение зарядов приводит к экранировке внешнего электрического поля в центральной области образца. Из (8) следует, что абсолютная величина  $E(x)$  имеет в точке  $x_{0E} = -c/2G\alpha$  минимум, равный  $(d - c^2/4G\alpha)^{1/2}$ .

Дальнейший анализ полученного решения проведем для случая

$$\kappa = 1 \quad (\mu_n = \mu_p = \mu). \quad (14)$$

Координаты максимумов распределений  $n(x)$  и  $p(x)$  имеют вид

$$\left. \begin{aligned} x_{0n} &= (2d\alpha + n_0 L d^{1/2}) / (GL\mu + 2n_0 d^{1/2}), \\ x_{0p} &= L - x_{0n}, \\ x_{0E} &= L/2, \end{aligned} \right\} \quad (15)$$

где  $d$  определяется из уравнения

$$|U_0| = d^{1/2} L/2 + (4d - G\alpha L^2)^{1/2} / 8 (G\alpha)^{1/2} \ln [(2d^{1/2} + (G\alpha)^{1/2} L)^2 (2d^{1/2} - (G\alpha)^{1/2} L)]. \quad (16)$$

Условия (13) задают область изменения величины  $d$

$$\left. \begin{aligned} d_1 &< d < d_2, \\ d_1 &= \epsilon GL^2 / 2\mu\epsilon\epsilon_0, \\ d_2 &= [L\mu\alpha n_0 (1 + (1 + 8G\alpha (\mu n_0)^2)^{1/2})]^2 / 2. \end{aligned} \right\} \quad (17)$$

Учитывая, что  $|U_0|$  — монотонно возрастающая функция  $d$  ( $|U_0|'_d > 0$ ), из (17) получим условия на приложенное напряжение

$$|U_0(d_1)| < |U_0| < |U_0(d_2)|. \quad (18)$$

Заметим, что при  $U_0 = U_0(d_1)$  в точке  $x_{0E}$  происходит полная экранировка внешнего поля.

Для исследования динамики фотоиндуцированного заряда задачи (1)—(3), (5) и (1)—(2), (4)—(5) решались численно конечно-разностным методом. С целью повышения точности расчетов осуществлялся переход от переменных  $n$  и  $p$  к квазипотенциалам  $\psi_n, \psi_p$  [7]

$$n = n_i \exp(\varphi - \psi_n), \quad p = n_i \exp(\psi_p - \varphi),$$

где  $\varphi$  — электростатический потенциал. Такой выбор переменных позволяет эффективно рассчитывать структуры с большими градиентами концентраций. Для численного решения применялась неявная разностная схема, устойчивая при произвольном соотношении шагов по времени и пространству, что потребовало организации итерационного процесса. В качестве исходных данных на новом временном слое брались значения квазипотенциалов  $\psi_n, \psi_p$  и потенциала  $\varphi$  с предыдущего временного слоя. Новые значения квазипотенциалов находились методом прогонки из конечно-разностных аналогов уравнений непрерывности. Уточненные значения квазипотенциалов подставлялись в уравнение Пуассона

$$\Delta\varphi = e\epsilon\epsilon_0 (n_i \exp(\psi_p - \varphi) - n_i \exp(\varphi - \psi_n)),$$

для решения которого применялся итерационный процесс Ньютона—Канторовича. После контроля сходимости итерационный процесс возобновлялся либо (при достижении заданной точности) осуществлялся переход на новый временной слой. В расчетах использовались следующие исходные данные:  $n_0 = p_0 = 2 \cdot 10^{10} \text{ см}^{-3}$ ,  $\tau = 10^{-4} \text{ с}$ ,  $\epsilon = 12$ ,  $L = 60 \text{ мкм}$ ,  $G = 5 \cdot 10^{19} \text{ см}^{-3} \text{ с}^{-1}$ . Результаты расчетов представлены на рис. 1—5.

На рис. 1 приведены полученные из численных расчетов установившиеся распределения  $n(x)$  и  $j_p(x)$  для случая  $\kappa = 1$  ( $\mu = 480 \text{ см}^2 \text{ В}^{-1} \text{ с}^{-1}$ , коэффициенты  $D$  и  $\mu$  связаны соотношением Эйнштейна,  $D = \varphi_T \mu$ ,  $\varphi_T$  — тепловой потенциал,  $\varphi_T = 0.025 \text{ В}$ ),  $U_0 = -2 \text{ В}$ , а также распределения, рассчитанные по формулам (8), (11). Видно хорошее согласие результатов численных и

аналитических расчетов. Меньшая величина максимума  $n(x)$  в случае численного расчета обусловлена действием диффузии, которая также приводит к резкому скачку в распределении  $n(x)$  на правом контакте. Из расчетов следует, что рекомбинация оказывает несущественное влияние на процесс перераспределения фотоиндуцированных зарядов.

На рис. 2 приведена эволюция со временем концентрации электронов и дырок для случая металлических (рис. 2, а) и диэлектрических контактов (рис. 2, б).

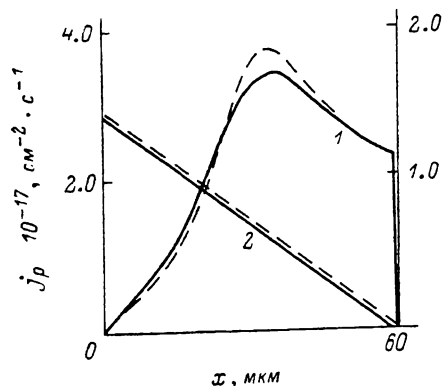


Рис. 1. Распределения концентраций  $n$  (кривые 1) и абсолютной величины потока концентрации дырок  $j_p$  (кривые 2), полученные из численного решения (сплошные линии) и рассчитанные по формулам (8), (11) (штриховые линии).

б);  $\mu_n = 1380 \text{ cm}^2 \text{ V}^{-1} \text{ c}^{-1}$ ,  $\mu_p = 480 \text{ cm}^2 \text{ V}^{-1} \text{ c}^{-1}$ ,  $U_0 = -1 \text{ В}$ . На начальной стадии процесса ( $t < t_n^e$ ) действие генерации приводит к однородному росту концентрации электронов и дырок в центральной области. В области левого контакта под действием электрического поля происходит снос электронов в направлении положительного электрода, соответственно дырки из области правого контакта сносятся к отрицательному (левому) электроду — образуется пространственное разделение заряда. Поле в образце

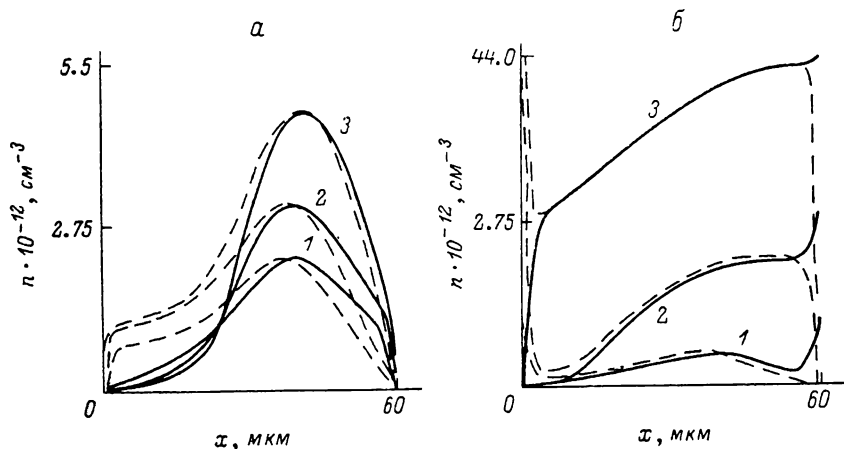


Рис. 2. Распределения концентраций  $n$  (сплошные линии) и  $p$  (штриховые линии) на момент времени.

$t$ , мкс: 1 — 0.1, 2 — 0.2, 3 — 1.6. а — металлические контакты (3), б — диэлектрические контакты (4).

становится неоднородным, возрастая по абсолютной величине у контактов и спадая в центральной области. В результате при  $t_n^e < t < t_n^p$  формируются волны пространственного заряда, движение которых прекращается при  $t > t_n^p$ . В центральной области п/п образца в распределениях  $n(x, t)$ ,  $p(x, t)$  наблюдаются одни и те же характерные особенности как для случая металлических, так и для случая диэлектрических контактов. В приконтактных областях распределение концентраций определяется типом контакта:  $n(x, t)$  в случае металлических контактов на правом конце резко обрывается при  $x \sim 58 \text{ мкм}$  до  $n_0$ , в случае же диэлектрических контактов после плавного спада концентрации  $n(x, t)$  при  $38.3 \text{ мкм} < x < 52.7 \text{ мкм}$  следует резкий скачок распределения электронов, прижимающихся к пра-

вому контакту. Из оценок диффузионной составляющей следует, что ее вклад в плотность потока концентрации не превышает 10 % во всей рассматриваемой области, кроме прикатодного участка, где образуются большие градиенты концентрации электронов, и диффузионная составляющая потока становится сравнимой с дрейфовой составляющей. Такой же характер имеет и распределение дырок  $p(x, t)$  с точностью до направления движения носителей. При  $t \gg t_{ii}^p$  в случае металлических контактов происходит лишь количественный рост концентрации, и к моменту времени  $t \sim 1.6$  мкс процесс устанавливается. В случае же диэлектрических контактов происходит качественная перестройка распределений  $n(x, t)$ ,  $p(x, t)$ : максимум в распределении  $n(x, t)$  исчезает, накопление неравновесных носителей заряда приводит к установлению квазинейтральности в центральной области, нарушаемому в приконтактных областях. В дальнейшем вследствие роста концентрации неравновесных носителей заряда роль рекомбинации усиливается и распределения  $n(x, t)$ ,  $p(x, t)$  в центральной области выравниваются:  $n(x, t) \approx p(x, t)$ .

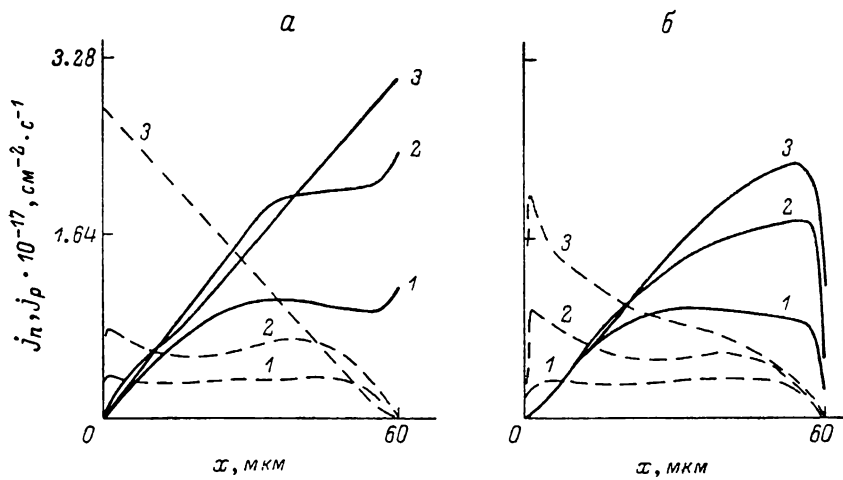


Рис. 3. Распределения абсолютных величин потоков концентраций  $j_n$  (сплошные линии) и  $j_p$  (штриховые линии) на моменты времени.  $t$ , нс: 1 — 9, 2 — 20; 3 — 1.6 мкс. а — металлические контакты (3), б — диэлектрические контакты (4).

На рис. 3 приведены распределения абсолютных величин потоков концентрации  $j_n$  и  $j_p$  в различные моменты времени. Распределения для ранних моментов времени (кривые 1, 2) имеют качественно и количественно сложный характер независимо от типа контактов. На стадии образования волн пространственного заряда ( $t < 20$  нс)  $j_n$ ,  $j_p$  имеют максимумы в точках  $x_{ojn}$ ,  $x_{ojp}$ , причем  $x_{ojn} \approx x_{on}$ ,  $x_{ojp} \approx x_{op}$ . После остановки пиков концентрации максимумы потоков  $j_n$ ,  $j_p$  смещаются в сторону границ области и затем исчезают в случае металлических контактов, а в случае диэлектрических контактов эти максимумы останавливаются в приграничной области. После выхода процесса на стационарный режим (случай металлических контактов) распределения  $j_n$ ,  $j_p$  имеют характер линейной зависимости от  $x$  с коэффициентом пропорциональности  $G$ , что согласуется с полученными аналитическими соотношениями (11). Установление квазинейтральности в случае диэлектрических контактов сопровождается резким спадом абсолютных величин  $j_n$ ,  $j_p$ .

Поведение абсолютной величины полного тока  $j$  с течением времени иллюстрирует рис. 4. На малых временах ( $t < t_{ii}^e$ ) ток возрастает по закону, близкому к линейному. На стадии формирования волн пространственного заряда ( $t_{ii}^e < t < t_{ii}^p$ ) рост тока замедляется. Приведенные зависимости  $j(t)$  качественно согласуются с полученными на том же временном интервале

в работе [2] зависимостями фототока от времени для случая монополярной проводимости. При  $t > t_{\text{н}}^p$  в случае металлических контактов ток выходит на стационарное значение  $j = 2.95 \cdot 10^{17} \text{ см}^{-2} \text{ с}^{-1}$ , что с точностью до 10 % согласуется с расчетным (формула (12)). В случае диэлектрических контактов после достижения к моменту времени  $t = 100 \text{ нс}$  максимального значения  $j_{\text{м}} = 2.3 \cdot 10^{17} \text{ см}^{-2} \text{ с}^{-1}$  в распределении  $j(t)$  имеется участок медленного спада, а после установления квазинейтральности (к моменту времени  $t \sim 1.3 \text{ мкс}$ ) наблюдается резкое убывание тока.

Таким образом, процесс перераспределения фотоиндуцированных зарядов в полупроводниках с собственной проводимостью в случае металлических контактов приводит к установлению распределений электронов и

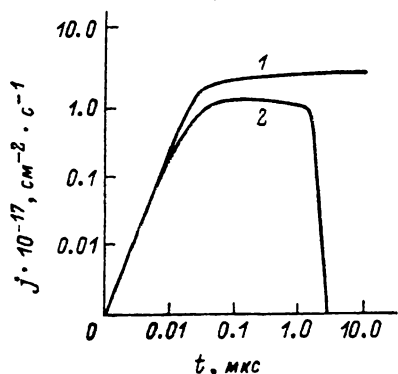


Рис. 4. Зависимость абсолютной величины полного тока  $j$  от времени.

1 — металлические контакты (3), 2 — диэлектрические контакты (4).

дырок с максимумами, величины и координаты которых определяются параметрами п/п образца, приложенным напряжением и интенсивностью фотогенерации. Подобное распределение фотоиндуцированных носителей возникает не только в случае металлических контактов (3), достаточным условием его возникновения является возможность инжекции через контакт. Из численных расчетов следует, что и в случае однородно-легированных п/п при межзонной генерации неравновесных носителей возникает установившееся распределение носителей заряда с максимумами концентраций. Рассматривался случай неоднородной генерации  $G(x) = G_0 \exp(-\alpha x)$  (физически такая ситуация реализуется при освещении через торец образца,  $\alpha$  — коэффициент межзонного поглощения). Численные расчеты показали, что и в этой ситуации существует указанный режим. Таким образом, установленный эффект имеет достаточно общий характер. Используя полученное нами аналитическое выражение для фототока (12), можно экспериментально определять подвижности электронов и дырок в п/п с собственной проводимостью.

#### Л и т е р а т у р а

- [1] Астратов В. Н., Ильинский А. В., Киселев В. А. ФТТ, 1984, т. 26, № 9, с. 2843—2851.
- [2] Брыксин В. В., Коровин Л. И. ФТТ, 1984, т. 26, № 11, с. 3415—3425.
- [3] Брыксин В. В., Коровин Л. И., Кузьмин Ю. И. ФТТ, 1986, т. 28, № 1, с. 148—155.
- [4] Жданова Н. Г., Коган М. С., Суриц Р. А., Фукс Б. И. ЖЭТФ, 1978, т. 74, № 1, с. 364—371.
- [5] Константинов О. В., Перель В. И. ФТТ, 1964, т. 6, № 11, с. 3364—3371.
- [6] Lee C. H., Mak P. S., De Fonzo A. P. IEEE J. Quant. Electron., 1980, QE-16, p. 277—288.
- [7] Майоров С. А., Руденко А. Л., Шишкин А. В. ЖВМ и МФ, 1980, т. 20, № 1, с. 112—120.

Московский инженерно-физический институт  
Москва

Поступило в Редакцию  
22 мая 1987 г.  
В окончательной редакции  
28 сентября 1987 г.